SOME ASPECTS OF THE ELASTIC ANISOTROPY OF SOLIDS

SHRIKANTH S.

Doctor of Philosophy

DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

APRIL 2023

SOME ASPECTS OF THE ELASTIC ANISOTROPY OF SOLIDS

by

Shrikanth S.

Department of Materials Science and Engineering

Submitted in fulfilment of requirements of degree of
Doctor of Philosophy
to the

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

APRIL 2023

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis entitled "**SOME ASPECTS OF THE ELASTIC ANISOTROPY OF SOLIDS**" is being submitted by **Mr. SHRIKANTH S.** to the Indian Institute of Technology Delhi for the award of the degree of **DOCTOR OF PHILOSOPHY**. This is a record of bonafide research work carried out by him under our supervision and guidance. The matter presented in this thesis has not been submitted, in part or in full to any other University or Institute for the award of any degree or diploma.

Prof. Rajesh Prasad

Professor

Department of Materials Science and Engineering

Indian Institute of Technology Delhi

Prof. Suresh Neelakantan

Associate Professor

Department of Materials Science and Engineering

Indian Institute of Technology Delhi

Acknowledgements

This thesis is a result of studies that I carried out, along with my supervisors, over a period of five years. I express my sincere gratitude to my supervisors, Professor Rajesh Prasad and Professor Suresh Neelakantan for their guidance and support. On an equal note, I would like to thank Professor Kevin M. Knowles, of the Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, for his guidance and encouragement. His sincerity and organised approach towards research made hard work look effortless and pushed me out of my comfort zone. I feel truly honoured to have worked with him.

The contents of this thesis are largely based on the concept of tensors which I picked up from the course 'Micro and nanoscale mechanical behaviour of materials' taught by one of my supervisors, Professor Rajesh Prasad, in my first year of Ph.D. Learning from him was the most delightful part of my Ph.D. experience. The innumerable open-ended discussions that we had over the years have greatly improved my understanding of various academic topics and shaped my views on becoming a better researcher. I am extremely thankful to him and his wife, Dr. Rachna Prasad, for their constant support, timely advice and the delicious meals at their home.

When I joined the institute, I was warmly welcomed to the 'Materials Family' by my labmates Aravi, Gaurav, Shanta, Aditya, Vickey, Prashant, Hemant and Anuz. They also got me trained in handling various testing equipment, gave valuable insights into Ph.D. life, and promoted a healthy work culture. We were further joined by a bunch of other enthusiastic researchers – Deepak, Ranjeet, Noor, Kasi, Amit, Chetan, Abhishek, Himanshu, Priyanka, Bushra, Ashwani, Ashitha, Karthik, Subhakar, Ayushi, Rashi, Amey, Surajbhan and Junaid. The lab was indeed a great workspace and I thank all my labmates and lab staff for their company and cooperation. I would also like to acknowledge the occasional enlightening discussions with Dr. Sarvesha from IIT Kanpur.

A good amount of my time at IIT Delhi was spent on the football field. Being a part of the institute football team was a parallel journey filled with joy, hard work and sacrifices. I would like to thank the coaches from Bhaichung Bhutia Football Schools and my wonderful teammates for the unforgettable memories that we made together.

Outside of the lab and football field, my stay at IIT Delhi was also enlivened by my friends – Sasi, Sriram, Rajeev, Della, Arshad, Chaithra, Nazil, Sasi Sir, Roshni, Abhimanyu, Amjad, Suraj, Saran, Kunjayi, Dhishana, Biyo, Abitha and Henna. Be it movies or the inevitable coffee breaks, these were the folks who were always around to ease things out.

Some friends are as good as family or even better. For me, Jessel, Divya and Ann have always had my back. These are people who celebrate my successes more than myself. They are also the ones who are more concerned about my difficulties than myself. I also have my brothers from NIT Rourkela close to my heart. Deekshith, Sarath, Vishnu, Sameeh, Vivek and Krishnan – they all kept visiting me in Delhi to roll back the years. I am sure none of them will accept a thanks from me. So, I leave it here.

Most importantly I wish to express my gratitude to my family. I was raised in a home with a father who stressed on the importance of logic and reasoning in daily life, a mother who held up affection and care over anything else, and an elder brother who competed against me for everything in the world. I am still driven forward by this mix of reasoning, love, and determination. As a child, I wanted to become a scientist, and my family has supported every decision that I have taken in that direction. Of late, I have not been able to spend as much time as I would have liked with them. Nevertheless, I have tried to make sure that the time spent away from them was being utilised justly.

I present my doctoral thesis ahead.

06/04/2023

SHRIKANTH S.

Abstract

In this thesis, new aspects of the anisotropy of the Poisson's ratio, shear modulus and biaxial modulus have been investigated. This study also includes the evaluation of an existing method of determining the Young's modulus of anisotropic materials using indentation measurements. Further, a new method to determine the elastic constants of cubic crystals from indentation measurements alone is proposed.

When a property or phenomenon varies with the direction of measurement, it is said to be anisotropic. Elastic properties of single crystals, layered/fiber-reinforced composites and textured polycrystals are few common examples of anisotropic materials. Random polycrystals, glasses and other amorphous materials are generally isotropic. The anisotropy of a material properties can be characterised using their tensor descriptions. The elastic response of linear elastic solids is governed by the Hooke's law. Stresses and strains are second-rank tensors while the stiffness/compliance constants are fourth-rank tensors.

Neumann's principle states that the symmetry elements of any physical property of a crystal must include the symmetry elements of the point group of the crystal. Therefore, the anisotropy of elastic properties of crystals are closely related to its symmetry. The anisotropy of properties like the Young's modulus (E), shear modulus (G) and Poisson's ratio (ν) have been extensively investigated. When the loading direction is confined within a plane with a three- or six-fold rotational symmetry, the Young's modulus has been reported to be invariant throughout the plane. The Poisson's ratio and shear moduli are also known to be invariant when the transverse plane and shear plane, respectively, possess a three-, four-, or six-fold symmetry. In the current study, it is found that transverse/shear planes without symmetry can also have invariant Poisson's ratio/shear modulus. Conditions on the elastic constants for the occurrence of such planes are identified and expressions for such plane normals are derived for all crystal systems.

The anisotropy in properties is observed in all forms of crystalline materials. Crystalline thin films deposited on substrates develop stresses and strains within the film. These stresses can be high and may result in the formation of defects or cracks. The actual states of stresses and strains within a film are not easily measurable. Hence, the biaxial modulus (B) is defined as the ratio of the in-plane tensile stress to the corresponding longitudinal strain under a state of equibiaxial strain or equibiaxial stress. It also appears in the Stoney equation which is used to determine the stresses in thin films from the measurement of its curvature. In the case of isotropic films, the biaxial modulus is given by $E/(1-\nu)$, and the states of equibiaxial strain and stress are equivalent. For anisotropic films, it is important to use the appropriate expressions for the biaxial modulus while determining the film stresses. The expressions for standard film orientations such as {001}, {110} and {111} of cubic films are known. In the current study, expressions for the biaxial moduli of thin films with a general (hkl) orientation are derived. Film planes within which the biaxial modulus remains independent of the direction of measurement are also identified for all crystal systems. An in-depth study on the case of cubic thin films is also carried out. The global extrema are identified and the expressions for the shear strains and out-of-plane normal strain are derived. The significance of the choice of boundary conditions is demonstrated by comparing the biaxial modulus derived under a zero shear strain state with that under a zero shear stress state.

The anisotropy of small-scale deformation processes can be studied using nanoindentation. Nanoindentation tests give a load-displacement (P-h) curve from which the contact stiffness can be estimated. The indentation modulus (M) is a property of the indented material and the geometry of the indenter. The indentation modulus of isotropic materials is the same as its plane strain Young's modulus which is given by $E/(1-\nu^2)$. In the case of anisotropic materials, M is a complicated function of the indented plane, elastic constants of the indented material, and the indenter geometry. A common practice is to use the isotropic

equation with the measured value of M and an assumed value of the bulk Poisson's ratio to determine the Young's modulus of anisotropic materials along the direction of indentation. The validity of such an approximation is examined in this study. It is found that $E_{(hkl)} = M_{(hkl)}(1-\nu^2_{isotropic})$ is highly likely to give reasonable results when the indented plane is either cubic {110} or any prismatic plane of hexagonal materials. In the case of other planes, the need to use appropriate equations accounting for the anisotropy is emphasised.

The elastic (stiffness/compliance) constants provide complete information regarding the elastic deformation response of solids. Relatively convenient and reliable methods like resonant ultrasound spectroscopy and Brillouin scattering are applicable to single crystalline specimens alone. Most of the materials with useful applications are polycrystals. However, simple, and effective methods to extract the elastic constants from polycrystalline specimens are not well established. Methods that combine nanoindentation measurements with electron backscatter diffraction (EBSD) have been developed to extract the elastic constants. Such methods either involve complex computations, use approximate relationships, or require the value of at least one bulk elastic property to be known/assumed. In the current study, approximate closed form expressions, with improved accuracy, are derived for the indentation moduli on the {100}, {110} and {111} planes of cubic materials. On identifying grains with these orientations within the polycrystal using EBSD, the indentation moduli can be measured, and the three independent elastic constants of the cubic crystallites are obtained.

सार

इस थीसिस में, पोयसन अनुपात, शियर मॉड्यूलस और बाईएक्सियल मॉड्यूलस की एनिसोट्रोपी के नए पहलुओं का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में, एक विद्यमान विधि के माध्यम से एनिसोट्रोपिक माल के यंग मॉड्यूलस की निर्धारण की जांच भी शामिल है जो इंडेंटेशन मापनों का उपयोग करता है। इसके अलावा, एक नया तरीका प्रस्तावित किया गया है जिसके माध्यम से क्यूबिक क्रिस्टलों की लचीली संख्याएँ केवल इंडेंटेशन मापनों से निर्धारित की जा सकती हैं।

जब कोई गुणधर्म या घटना माप की दिशा से अलग-अलग होता है, तब इसे अनिसोट्रोपिक कहा जाता है। एकीकृत क्रिस्टल, तहती/फाइबर-बलगम संयोजन और बनावटयुक्त बहुक्रिस्टल की लचीली गुणधर्म कुछ अनिसोट्रोपिक माल के उदाहरण हैं। यादृच्छिक बहुक्रिस्टल, काँच और अन्य अमूर्त उपद्रव आमतौर पर इसोट्रोपिक होते हैं। एक वस्तु के गुणधर्मों की अनिसोट्रोपी का विवरण उनके टेंसर विवरणों का उपयोग करके किया जा सकता है। रॉयड़ के समान लचीले ठोस वस्तुओं का लचीला प्रतिसाद हूक का कानून द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तनाव और तनाव परिवर्तन द्वितीय-श्रेणी के टेंसर होते हैं जबकि कठोरता / अनुपालन संयती निश्चित-श्रेणी के टेंसर होते हैं।

नेउमैन का सिद्धांत बताता है कि क्रिस्टल की किसी भी भौतिक गुणधर्म की सममिति उसके पॉइंट ग्रुप की सममितियों को शामिल करनी चाहिए। इसलिए, क्रिस्टल की कठोर गुणधर्मों की अनिसोट्रोपी उसकी सममिति से गंभीरता से जुड़ी होती है। यंग की मॉड्यूलस (E), शेयर मॉड्यूलस (G) और पोइसन अनुपात (ν) जैसी गुणधर्मों की अनिसोट्रोपी का व्यापक अध्ययन किया गया है। जब लोडिंग दिशा को तीन- या छ: -फोल्ड घुमावदार सममिति वाले एक समतल में सीमित किया जाता है, तब यंग की मॉड्यूलस का रिपोर्टेड वैरियंट समतल के अंतर्गत भी अचल होता है। पॉयसन अनुपात और शेयर मॉड्यूलस भी जाना जाता है कि जब त्रिविमानीय आयतन और काटने वाली तल, चार- चाहे या छह-फोल्ड सममिति के साथ होती है, तो पॉयसन अनुपात और शेयर मॉड्यूलस भी समान रहते हैं। वर्तमान अध्ययन में, यह पाया गया है कि बिना सममिति वाली त्रांसवर्स/शेयर तल भी अक्षम पॉयसन अनुपात/शेयर मॉड्यूलस को अक्षम कर सकते हैं। इस प्रकार के तलों के घटने के लिए केंद्रीय गुणों पर शर्तें पहचानी जाती हैं और सभी क्रिस्टल प्रणालियों के लिए ऐसे तलों के निर्धारण तत्वों को प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्तियाँ निकाली जाती हैं।

गुणों में विषमता को क्रिस्टलीय सामग्रियों के सभी रूपों में देखा जाता है। परतों पर विकसित क्रिस्टलीय पतली फिल्मों में तनाव और तनाव पैदा होता है। ये तनाव अधिक हो सकते हैं और दोष या दरारों के गठन की वजह बन सकते हैं। फिल्म के भीतर तनाव और तनाव की वास्तविक स्थिति आसानी से मापने योग्य नहीं होती है। इसलिए, बिएक्सियल मॉड्यूलस (B) को इक्विबिएक्सियल तनाव या इक्विबिएक्सियल तनाव की स्थिति में चौड़ाई माप के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका उपयोग थिन फिल्मों के तनाव को उसकी घुमाव के माप से निर्धारित करने के लिए उपयोग में आता है। जैसे कि इसोट्रोपिक फिल्मों के मामले में, बिएक्सियल मॉड्यूलस $E/(1-\nu)$ द्वारा दिया जाता है, और समान दो-धारी तन और तनाव की स्थितियां समान होती हैं। अनिसोट्रोपिक फिल्मों के मामले में, फिल्म तनाव का निर्धारण करते समय बिएक्सियल मॉड्यूलस के उचित अभिव्यक्तियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। घनवर्तुल फिल्मों के {001}, {110} और {111} जैसी मानक फिल्म अभिविन्यासों के लिए अभिव्यक्तियां जानी जाती हैं। वर्तमान अध्ययन में, एक सामान्य (hkl) अभिविन्यास वाली पतली फिल्मों के लिए बिएक्सियल मॉड्यूलस की अभिव्यक्तियां निकाली जाती हैं। सभी क्रिस्टल प्रणालियों के लिए, जिन फिल्म तनाव तथा तन की दिशा से निर्धारण की दिशा के अनुपात में बिएक्सियल मॉड्यूलस स्वतंत्र होता

है, उन फिल्मों की तल तालिका भी पहचानी जाती है। घनवर्तुल पतली फिल्मों के मामले पर भी एक विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वैश्विक न्यूनतम तथा अधिकतम मान निर्धारित किए जाते हैं और कटाव तनों तथा तल तालिका के लिए अभिव्यक्तियां निकाली जाती हैं। सीमाओं के चयन की महत्वता, शून्य कटाव तन अवस्था तथा शून्य कटाव तनाव अवस्था के तहत प्राप्त बिएक्सियल मॉड्यूलस को तुलना करके दिखाई देती है।

नैनोइंडेंटेशन का उपयोग करके छोटे स्तर की विकर्षण प्रक्रियाओं की विभिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है। नैनोइंडेंटेशन परीक्षणों से एक भार-विस्थापन (P-h) रुपरेखा दी जाती है, जिससे संपर्क स्टिफ़्नेस का अनुमान लगाया जा सकता है। धातु की इंडेंटेशन मॉड्यूलस (M) एक गुण है, जो इंडेंटेशन के ज्यामिति तथा इंडेंटर के ज्यामिति के आधार पर निर्धारित होता है। इसोट्रोपिक सामग्री का इंडेंटेशन मॉड्यूलस उसके प्लैन स्ट्रैन यंग का मॉड्यूलस होता है ($E/(1-\nu^2)$)। द्विअभिमतीय सामग्रियों के मामले में, एम इंडेंटेशन की सतह, इंडेंटेड सामग्री के कसैतनीय संख्याओं, और इंडेंटर के ज्यामिति की एक जटिल फ़ंक्शन होता है। एक सामान्य अभ्यास है कि अभिमतीय सामग्रियों के यंग का मॉड्यूलस इसोट्रोपिक समीकरण का उपयोग करते हुए इंडेंटेशन की दिशा के अनुसार मापी जाती है। इस अध्ययन में ऐसी अनुमानित तकरीब की वैधता की जांच की गई है। यह पाया गया है कि जब इंटेंडेड प्लेन क्यूबिक {110} या हेक्सेगोनल सामग्री के किसी भी प्रिस्मात्मक तल पर हो तब वह उच्च रूप से उचित परिणाम देने के लिए बहुत संभावित होता है। अनुसूचितता के लिए उपयुक्त समीकरणों को उल्लेख करते हुए दूसरे तलों के मामले में एनिसोट्रोपी का खाता रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

इलास्टिक कान्स्टन्टस (स्टिफ्नस/कम्प्लाइअन्स) ठोस पदार्थों की लचीली उपचुंखता प्रतिक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय आसान और विश्वसनीय तकनीकें जैसे रिसोनेंट अल्ट्रासाउंड स्पेक्ट्रोस्कोपी और ब्रिल्लुआँ स्कैटरिंग केवल एकल क्रिस्टल नमूनों के लिए उपयुक्त होती हैं। उपयोगी एप्लिकेशन वाले अधिकांश सामग्रियां बहुक्रिस्टल होती हैं। हालांकि, बहुक्रिस्टल नमूनों से लचीले निर्देशकों को निकालने के लिए सरल और प्रभावी तरीके अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। नैनोइंडेंटेशन मापनों को इलेक्ट्रॉन बैकस्कैटर डिफ्रेक्शन (EBSD) के साथ मिलाकर लचीले निर्देशकों को निकालने के लिए तरीके विकसित किए गए हैं। ऐसे तरीकों में या तो जटिल गणनाओं का उपयोग करते हैं, अनुमानित संबंधों का उपयोग करते हैं या कम से कम एक बल्क लचीला गुणधर्म ज्ञात / माना जाना आवश्यक होता है। वर्तमान अध्ययन में, घन पदार्थों के {100}, {110} और {111} तलों पर इंडेंटेशन मॉड्यूलस के लिए समीकरणों को बेहतर निश्चितता के साथ बनाया गया है। EBSD का उपयोग करके पॉलीक्रिस्टल के भीतर इन अवस्थाओं के साथ अणुओं की पहचान करते हुए, इंडेंटेशन मॉड्यूलस को मापा जा सकता है, और घन त्रिज्या के तीन इलास्टिक कान्स्टन्टस को प्राप्त किया जा सकता है।

Table of Contents

List of Figures

List of Tables

List of Symbols

σ_{ij}	Stress field
σ_i	Stress field (matrix notation)
σ_i'	σ_i with respect to $x_1' - x_2' - x_3'$, a transformed coordinate system
ε_{ij}	Strain field
ε_i	Strain field (matrix notation)
ε_i'	ε_i with respect to $x_1' - x_2' - x_3'$, a transformed coordinate system
c_{ijkl}	Elastic stiffness tensor
s_{ijkl}	Elastic compliance tensor
c_{ij}	Elastic stiffness (matrix notation)
c_{ij}'	c_{ij} with respect to $x_1' - x_2' - x_3'$, a transformed coordinate system
s_{ij}	Elastic compliance (matrix notation)
s_{ij}'	s_{ij} with respect to $x_1' - x_2' - x_3'$, a transformed coordinate system
a_{ij}	Direction cosine matrix between the transformed $(x_1' - x_2' - x_3')$ and untransformed ($x_1 - x_2 - x_3$) coordinate systems
θ	Angle between x_1 and the projection of x_3' on the $x_1 - x_2$ plane, for a coordinate transformation from the $x_1 - x_2 - x_3$ system to the new system $(x_1' - x_2' - x_3')$
ϕ	Angle between x_3 and x_3', for a coordinate transformation from the old $(x_1 - x_2 - x_3)$ system to the new system $(x_1' - x_2' - x_3')$
ψ	Angle between the meridional tangent to x_3' and x_1', for a coordinate transformation from the old $(x_1 - x_2 - x_3)$ system to the new system $(x_1' - x_2' - x_3')$
n	Unit vector normal to the considered plane

$\mathbf{m}$	Unit vector perpendicular to **n**
W	Elastic strain energy per unit volume
E	Young's modulus
$E_{(hkl)}$	Young's modulus along the normal to the plane (*hkl*)
E_m	Young's modulus obtained using the relationship between the Young's modulus, Poisson's ratio and the indentation modulus of isotropic materials
ν	Poisson's ratio
$\nu_{isotropic}$	Poisson's ratio of the polycrystalline sample
$\hat{\nu}$	Areal Poisson's ratio
G	Shear modulus
G^V	Voigt average of the shear modulus
G^R	Reuss average of the shear modulus
K	Bulk modulus
K^V	Voigt average of the shear modulus
K^R	Reuss average of the shear modulus
B	Biaxial modulus
B_σ	Biaxial modulus of thin films under equibiaxial stress
B_ε	Biaxial modulus of thin films under equibiaxial strain when there are no stresses acting normal to the film plane
$\tilde{B}_\varepsilon$	Biaxial modulus of films under equibiaxial strain when there are no shear strains
$B_\varepsilon^{(hkl)[uvw]}$	B_ε along [*uvw*] when the film plane is (*hkl*)
B_ε^{eff}	New average biaxial modulus defined under the state of equibiaxial strain in fiber-textured thin films
B^R	Reuss average of the biaxial modulus of fiber-textured films
B^V	Voigt average of the biaxial modulus of fiber-textured films

M	Indentation modulus
$M_{(hkl)}$	Indentation modulus for an indentation normal to the plane (*hkl*)
$\langle c_{ijkl} \rangle$	Polycrystalline average of c_{ijkl}
$\langle s_{ijkl} \rangle$	Polycrystalline average of s_{ijkl}
c_{ijkl}^{V}	Voigt average of c_{ijkl}
s_{ijkl}^{V}	Voigt average of s_{ijkl}
c_{ijkl}^{R}	Reuss average of c_{ijkl}
s_{ijkl}^{R}	Reuss average of s_{ijkl}
c_{ijkl}^{VRH}	Voigt-Reuss-Hill average of c_{ijkl}
s_{ijkl}^{VRH}	Voigt-Reuss-Hill average of s_{ijkl}
A	Zener anisotropy parameter for cubic materials
A^*	Chung-Buessem anisotropy index
A^{LM}	Ledbetter-Migliori anisotropy index
A^{U}	Universal anisotropy index
A^{L}	Log-Euclidean anisotropy parameter
$\sigma_{\parallel}$	Equibiaxial normal stress acting parallel to the film plane
$\varepsilon_{\parallel}$	Equibiaxial normal strain acting parallel to the film plane
$\varepsilon_{\perp}$	Longitudinal strain acting normal to the film plane
P	Indentation load
h	Depth of indentation from the original undeformed surface

S	Contact stiffness
E_r	Reduced modulus of the indenter and indented material
A_p	Area of contact between the sample and indenter projected on to the specimen surface against the direction of indentation
E_i	Young's modulus of the indenter
ν_i	Poisson's ratio of the indenter
K_ν	Difference between the extreme values of the Poisson's ratio (ν) on the most anisotropic transverse plane of a given material
K_G	Difference between the extreme values of the shear modulus (G) on the most anisotropic shear plane of a given material
H	Elastic anisotropy parameter for cubic materials defined by Hirth and Lothe